



(12) Wirtschaftspatent

Erteilt gemäß § 17 Absatz 1 Patentgesetz

(19) DD (11) 219 566 A1

4(51) G 01 B 11/02

AMT FÜR ERFINDUNGS- UND PATENTWESEN

In der vom Anmelder eingereichten Fassung veröffentlicht

(21) WP G 01 B / 253 744 2

(22) 05.08.83

(44) 06.03.85

(71) siehe (72)

(72) Trumpold, Harry, Prof. Dr.-Ing. habil., 9061 Karl-Marx-Stadt, Heimgarten 76; Troll, Christian, Dipl.-Ing.; Seidel, Hans-Hermann, Dipl.-Ing., DD

(54) **Hochauflösendes optisches Längenmeßverfahren mit codiertem Absolutmaßstab zur Durchführung des Verfahrens**

(57) Hochauflösendes optisches Längenmeßverfahren mit codiertem Absolutmaßstab zur Durchführung des Verfahrens, vorzugsweise zur absoluten Wegmessung und Positionierung im allgemeinen Maschinen- und Gerätebau, besonders unter den Bedingungen der automatisierten Produktion. Ziel der Erfindung ist es, Verfahren und Einrichtung zur absoluten Längenmessung zu schaffen, womit eine größere Auflösung bei gleichzeitig geringen Anforderungen an den Maßstab möglich ist. Dies wird dadurch erreicht, daß ein seriell codierter Absolutmaßstab auf dem in Meßrichtung zwischen den Maßstabsstrichen eine Strichcodierung angebracht ist, durch einen optoelektronischen Zeilensensor in Meßrichtung abgetastet wird und diese Information durch eine logische Schaltung zum Meßergebnis weiterverarbeitet wird. Dieses Verfahren wird auch zur Winkelmessung genutzt.

Hochauflösendes optisches Längenmeßverfahren mit codiertem Absolutmaßstab zur Durchführung des Verfahrens

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft ein Längenmeßverfahren zur absoluten Wegmessung und Positionierung z.B. im allgemeinen Maschinen- und Gerätebau, besonders unter den Bedingungen der automatisierten Produktion.

Charakteristik der bekannten technischen Lösungen

Es sind Meßverfahren zur absoluten Längenmessung bekannt, bei denen der Maßstab senkrecht zur Meßrichtung abgetastet wird. Bei diesen Verfahren enthalten die Absolutmaßstäbe mehrere in Meßrichtung nebeneinander angeordnete Codespuren (Trumpold, H.; Längenprüftechnik - Eine Einführung, 1. Auflage, VEB Fachbuchverlag Leipzig 1980).

Nachteilig wirkt sich aus, daß bei diesen Verfahren der Auflösung Grenzen durch die technologische Herstellung des Maßstabes gesetzt sind und die Anzahl der Codespuren mit zunehmender Meßlänge steigt. Die Auflösung entspricht somit dem kleinsten realisierbaren Abstand der Strichmarkierungen. Weiterhin sind Absolutmaßstäbe bekannt, bei denen die Positionsinformation in mehreren in Meßrichtung nebeneinander angeordneten Codespuren enthalten ist und diese Spuren rechtwinklig zur Meßrichtung abgetastet werden. Dabei nimmt die Anzahl der Codespuren mit steigender Meßlänge und Auflösung zu. Hierbei ist die Auflösung vom kleinsten realisierbaren Abstand der Strichmarkierungen abhängig.

22.NOV.1983*131023

Ziel der Erfindung

Die Erfindung hat das Ziel, ein Verfahren und eine Einrichtung zur absoluten Längenmessung zu schaffen, mit der eine Verringerung der notwendigen Codespuren bei gleichzeitiger
5 Verbesserung der Auflösung und geringeren Genauigkeitsanforderungen an den Maßstab erreicht wird.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Längenmeßverfahren zu entwickeln mit welchem es möglich wird, höhere Auflösungen
10 zu erzielen, als bei bisher bekannten Verfahren. Gleichzeitig soll mit geringeren Genauigkeitsanforderungen an den Maßstab auskommen werden als bisher.

Erfindungsgemäß wird das dadurch erreicht, daß dabei ein seriell codierter Absolutmaßstab längs in Meßrichtung so
15 auf einen optoelektronischen Zeilensensor projiziert wird, daß mindestens ein Maßstabsstrich und eine Strichcodierung vollständig abgebildet werden. Das projizierte Bild wird im optoelektronischen Zeilensensor in elektrische Signale gewandelt, die einer logischen Schaltung zugeführt werden.
20 Dort wird dieses elektrische Signal so weiterverarbeitet, daß aus der Strichcodierung die absolute Position des zugehörigen Maßstabsstriches und aus der Zuordnung dieses Maßstabsstriches und eines Zeilensensorelementes die Feinposition ermittelt wird. Damit entsteht in der logischen
25 Schaltung aus der absoluten Position und Feinposition das Meßergebnis. Dieses Meßergebnis kann durch abgespeicherte, gegebenenfalls in der Strichcodierung enthaltene Information korrigiert werden.

Zur Durchführung des Verfahrens wird dabei ein seriell codierter Absolutmaßstab verwendet, dessen Besonderheit da-
30 rin besteht, daß sich zwischen den Maßstabsstrichen in Meßrichtung eine Strichcodierung befindet, die die Information über die absolute Lage des Maßstabsstriches auf dem seriell codierten Absolutmaßstab enthält. Dabei kann der Maßstabsstrich Bestandteil der Strichcodierung selbst sein. Durch eine geeignete Wahl der Strichcodierung wird eine sichere Fehlererkennung ermöglicht.

Ist der seriell codierte Absolutmaßstab kreisbogenförmig ausgebildet, kann bei bekanntem Radius aus der gewonnenen Information der Winkelwert bestimmt werden.

Ausführungsbeispiel

5 Die Erfindung soll nachstehend an einem Ausführungsbeispiel näher erläutert werden.

Die auf dem Absolutmaßstab 1 seriell angeordneten Maßstabsstriche 2 und Strichcodierungen 3 werden über eine Optik 5 in Meßrichtung 7 abgetastet und auf einem optoelektronischen Zeilensensor 4 so abgebildet, daß mindestens ein Maßstabsstrich 2 und eine Strichcodierung 3 erfaßt werden. Dabei beinhaltet die Strichcodierung 3 die vollständige Information der Lageposition des zugehörigen Maßstabsstriches und zusätzliche Informationen, die eine Lesefehlererkennung und eventuelle Fehlerkorrektur ermöglichen. Der optoelektronische Zeilensensor 4 ist mit einer logischen Schaltung 6 verbunden, die aus der elektrischen Information des Zeilensensors das Meßergebnis bildet. Im konkreten Beispiel wurde eine CCD-Zeile mit einem Mikrorechner verbunden, der die Funktion der logischen Schaltung realisiert.

Erfindungsanspruch

1. Hochauflösendes optisches Längenmeßverfahren mit codiertem Absolutmaßstab zur Durchführung des Verfahrens unter Verwendung eines an sich bekannten elektronischen Abtastsystems, z.B. eines optoelektronischen Zeilensensors, dadurch gekennzeichnet, daß die Abtastung eines seriell codierten Absolutmaßstabes (1) in Meßrichtung (7), längs zum Absolutmaßstab (1), erfolgt, wobei mindestens ein Maßstabsstrich (2) und eine Strichcodierung (3) vollständig erfaßt und aus der Zuordnung von Maßstabsstrich (2) und Zeilensensorelement die Feinposition und aus der Strichcodierung die absolute Position über eine logische Schaltung (6) gewonnen wird.
2. Codierter Absolutmaßstab zur Durchführung des Verfahrens nach Punkt 1, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen den Maßstabsstrichen (2) eine Strichcodierung (3) angeordnet ist, wobei die Strichcodierung (3) die Positionsinformation des zugehörigen Maßstabsstriches sowie zusätzliche Informationen beinhaltet.
3. Codierter Absolutmaßstab nach Punkt 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Absolutmaßstab (1) auf einem Kreisbogen angeordnet ist.

Hierzu 1 Blatt Zeichnung

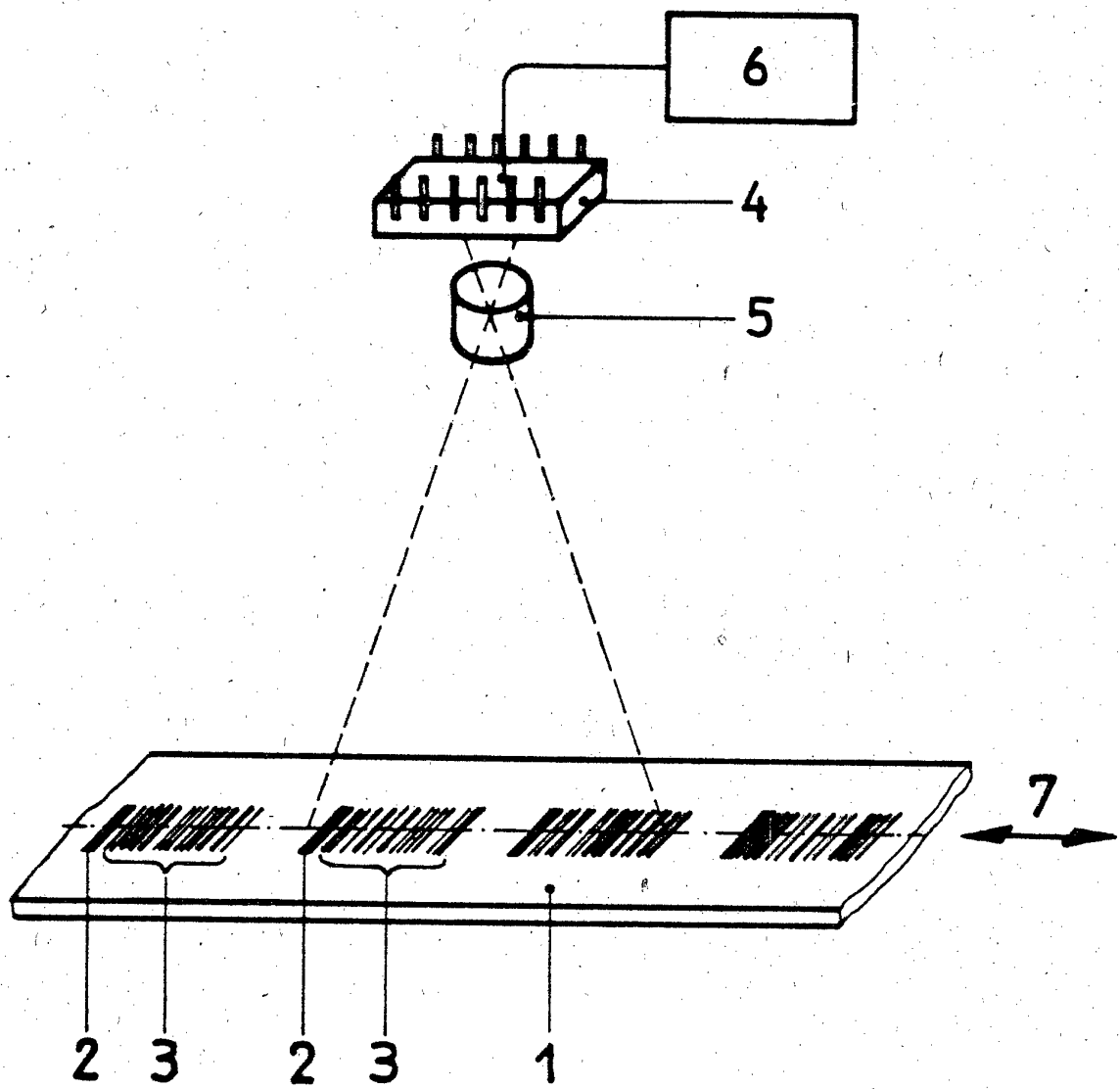


Fig. 1